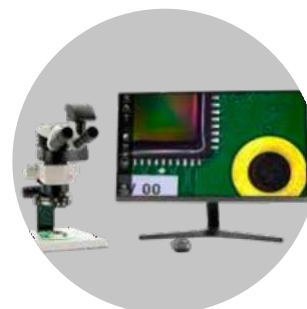
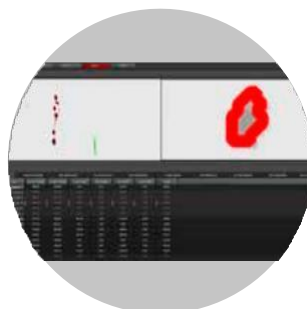


SISTEMI OTTICI PER LA MICROELETTRONICA

- > Microscopi Ottici (per Analisi Secondo ISO, ASTM, EN, Ecc.).
- > Microscopi per analisi LIBS
- > Microscopi Digitali
- > Microscopi RAMAN

21 Giugno 2023 | Ore: 9:00 – 16:30

ST Microelectronics, D1 Aula Vittorini Sciascia e Quasimodo



PROGRAMMA:

- 09.00.-10.00 La Microscopia Ottica
- 10.00-10.30 La tecnica LIBS per la microscopia
- 10.30-11.00. Break
- 11.00-12.00 Microscopia RAMAN
- 12.00-12.30 Preparazione per SEM/TEM
- 12.30-14.00 Break
- 14.00-16.30 Prove Pratiche

Saranno disponibili i seguenti strumenti:

Leica Microsystems:

- > Leica DM6
- > Leica Emspira 3
- > Suite di misura LAS X
- > Leica Enersight App
- > Leica DM6
- > Leica LIBS
- > Leica DM8000

Relatori:

- *Giancarlo Parma*
Leica Microsystems Advanced Workflow Specialist
- *Daniel Brigo*
Leica Microsystems CP Manager
- *Patrizio Brioschi*
Microcontrol NT Application Specialist
- *Riccardo Tagliapietra*
Renishaw Application Specialist

Unisciti ai nostri esperti per valutare insieme come:

- > tenere sotto controllo tutto del processo;
- > implementare le migliori pratiche per misurare i campioni; implementare e creare standard di lavoro;
- > raggiungere gli obiettivi richiesti.



Organised by:

Dr. Simona Boninelli, IMM-CNR
Dr. Domenico Mello, CTM Physics Lab, ST Microelectronics, Catania Manufacturing